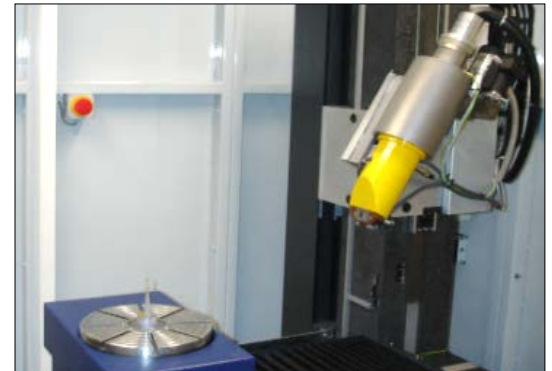




Computertomograph für Bauteilanalyse im μm -Bereich

Ray Scan 200

- 2D und 3D Material- und Gefügeanalysen
- Mikrostrukturanalyse
- Defektanalyse
- Messtechnische Aufgaben



Spezifikationen:

- Röntgenquelle: Mikrofokus 10-250 kV
- Brennfleck: 3-250 μm
- Objektmessungen \varnothing / H: 1-600 mm/1-1500 mm
- max. Objektgewicht: 80 kg
- Aktive Fläche Detektor: 410 x 410 mm²
- Detektorpixel: 1024 x 1024 (2048 x 2048 optional)
- Digitalisierung: 16 bit
- Messzeit incl. Rekonstruktion: 2 - 30 Min.
- Detailerkennbarkeit: 1 μm
- Kontrast: < 1 %
- Betriebsmodi: 3D-CT und Radioskopie

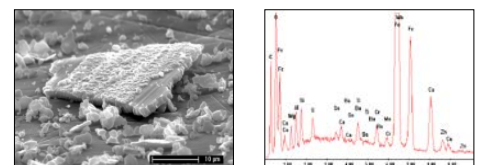
Rasterelektronenmikroskop mit Elementanalyse

JEOL JSM-6610 + EDX

Analyse von physikalischen und chemischen Eigenschaften im Nanobereich

Spezifikationen:

- Auflösung von 3 nm bei 30 kV
- Große Probenkammer (350x340x230)mm mit vollmotorisierter Probentisch und einem zulässigen Probengewicht von 5kg
- Proben mit einem Durchmesser bis 208mm können in jedem Oberflächenpunkt angefahren werden.
- Niederdruckbetrieb mit BSD ermöglicht hohe Auflösung auch bei ausgasenden Proben
- Integrierte Elementanalyse von Bor bis Americium



- 30 mm² aktive Detektorfläche
- Gold / Carbon Sputtersystem